

DIN EN ISO 3882:2024-04 (D)

Metallische und andere anorganische Überzüge - Übersicht über Verfahren zur Schichtdickenmessung (ISO 3882:2024); Deutsche Fassung EN ISO 3882:2024

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	7
Vorwort.....	8
Einleitung.....	10
1 Anwendungsbereich.....	11
2 Normative Verweisungen.....	11
3 Begriffe.....	11
4 Übersicht.....	11
5 Zerstörungsfreie Verfahren.....	12
5.1 Lichtschnittverfahren, ISO 2128.....	12
5.2 Magnetische Verfahren, ISO 2178 und ISO 2361.....	13
5.3 Wirbelstromverfahren, ISO 2360 und ISO 21968.....	13
5.4 Röntgenspektrometrisches Verfahren, ISO 3497.....	13
5.5 Betarückstreuverfahren, ISO 3543.....	14
6 Zerstörende Verfahren.....	15
6.1 Mikroskopisches (optisches) Verfahren, ISO 1463.....	15
6.2 Mehrstrahlinterferometrisches Verfahren nach Fizeau, ISO 3868.....	15
6.3 Profilometrisches Verfahren (Tasterverfahren), ISO 4518.....	15
6.4 Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop, ISO 9220.....	15
6.5 Auflösungsverfahren.....	16
6.5.1 Coulometrisches Verfahren, ISO 2177.....	16
6.5.2 Gravimetrisches Verfahren (Auflösen und Wägen), ISO 10111.....	16
6.5.3 Gravimetrisches (analytisches) Verfahren, ISO 10111.....	16
Anhang A (informativ) Typische Messanwendung und Messbereich.....	18
Literaturhinweise.....	23
Tabellen	
Tabelle 1 — Verfahren zur Messung der Schichtdicke.....	12
Tabelle A.1 — Anwendbarkeit verschiedener gebräuchlicher instrumenteller Verfahren zur Messung der Schichtdicke.....	19
Tabelle A.2 — Repräsentative Dickenbereiche von Messgeräten zur Schichtdickenmessung.....	22